

書籍のご案内

磁粉探傷試験Ⅲ 2009

編集：(社)日本非破壊検査協会

編集委員長 加藤 光昭

体裁：B5版, 161頁

定価：本体3,429円+税 (送料別)

磁粉探傷試験は、強磁性体の表面又は表面近傍に存在するきずを検出する方法として優れた能力をもつ試験法であり、構造物及び溶接部などの検査に広く利用されています。磁粉探傷試験には試験対象物及び目的に応じて種々な方法が適用されているため、それらの方法の原理を理解するとともに、試験方法にも熟達して間違いのない試験を実施する必要があります。

本書は、非破壊試験技術の進歩、規格の改正、そして国際的な整合化の動きなどの観点から、内容の見直しを適宜行ってきました。今回は、JIS G 0565 が改定され、JIS Z 2320-1, JIS Z 2320-2, JIS Z 2320-3 として制定された (JIS G 0565 は廃止されました) ため、必要な箇所はこれらの内容に準じて書き換えをするとともに、各種磁化方法で規定されている技術的背景も述べて、実際に適用していただくときの参考になるように配慮しました。さらに、いくつかの代表的な対象物を取り上げて、磁粉探傷試験の実際、信頼性及び手順書についても述べ、磁粉探傷試験部門のレベル3の資格を取得しようとする方がもっていただきたい理論、知識及び実際の試験方法の内容について見直しを行うとともに、応用性を高めていただけるように改訂版として刊行しました。

以下に目次を示す。

- 1 磁粉探傷試験のための電磁気の基礎
- 2 きずからの漏洩磁束
- 3 磁粉探傷試験の基本
- 4 磁粉探傷装置, 探傷用補材とその管理
- 5 磁粉探傷試験の実際
- 6 手順書の作成
- 7 漏洩磁束探傷法

以上

